



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval

Modules photovoltaïques (PV) en couches minces pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX



CONTENTS

FOREWORD.....	5
1 Scope and object.....	7
2 Normative references	7
3 Sampling.....	8
4 Marking	8
5 Testing.....	9
6 Pass criteria	9
7 Major visual defects.....	10
8 Report.....	10
9 Modifications	11
10 Test procedures	14
10.1 Visual inspection	14
10.1.1 Purpose.....	14
10.1.2 Procedure.....	14
10.1.3 Requirements	14
10.2 Maximum power determination	14
10.2.1 Purpose.....	14
10.2.2 Apparatus.....	14
10.2.3 Procedure.....	14
10.3 Insulation test.....	15
10.3.1 Purpose.....	15
10.3.2 Apparatus.....	15
10.3.3 Test conditions	15
10.3.4 Procedure.....	15
10.3.5 Test requirements.....	16
10.4 Measurement of temperature coefficients	16
10.4.1 Purpose.....	16
10.4.2 Apparatus.....	16
10.4.3 Procedure.....	16
10.5 Measurement of nominal operating cell temperature (NOCT).....	18
10.5.1 Purpose.....	18
10.5.2 Introduction	18
10.5.3 Principle	18
10.5.4 Apparatus.....	18
10.5.5 Test module mounting	19
10.5.6 Procedure.....	19
10.6 Performance at STC and NOCT	21
10.6.1 Purpose.....	21
10.6.2 Apparatus.....	22
10.6.3 Procedure.....	22
10.7 Performance at low irradiance	22
10.7.1 Purpose.....	22
10.7.2 Apparatus.....	22
10.7.3 Procedure.....	22
10.8 Outdoor exposure test.....	23

10.8.1	Purpose.....	23
10.8.2	Apparatus.....	23
10.8.3	Procedure.....	23
10.8.4	Final measurements.....	23
10.8.5	Requirements.....	23
10.9	Hot-spot endurance test.....	23
10.9.1	Purpose.....	23
10.9.2	Hot-spot effect.....	23
10.9.3	Classification of cell interconnection.....	24
10.9.4	Apparatus.....	25
10.9.5	Procedure.....	25
10.9.6	Final measurements.....	26
10.9.7	Requirements.....	26
10.10	UV preconditioning test.....	27
10.10.1	Purpose.....	27
10.10.2	Apparatus.....	27
10.10.3	Procedure.....	27
10.10.4	Final measurements.....	27
10.10.5	Requirements.....	27
10.11	Thermal cycling test.....	27
10.11.1	Purpose.....	27
10.11.2	Apparatus.....	28
10.11.3	Procedure.....	28
10.11.4	Final measurements.....	28
10.11.5	Requirements.....	29
10.12	Humidity-freeze test.....	29
10.12.1	Purpose.....	29
10.12.2	Apparatus.....	29
10.12.3	Procedure.....	30
10.12.4	Final measurements.....	30
10.12.5	Requirements.....	30
10.13	Damp heat test.....	30
10.13.1	Purpose.....	30
10.13.2	Procedure.....	30
10.13.3	Final measurements.....	30
10.13.4	Requirements.....	30
10.14	Robustness of terminations test.....	31
10.14.1	Purpose.....	31
10.14.2	Types of terminations.....	31
10.14.3	Procedure.....	31
10.14.4	Final measurements.....	32
10.14.5	Requirements.....	32
10.15	Wet leakage current test.....	32
10.15.1	Purpose.....	32
10.15.2	Apparatus.....	32
10.15.3	Procedure.....	32
10.15.4	Requirements.....	32
10.16	Mechanical load test.....	33
10.16.1	Purpose.....	33

10.16.2	Apparatus	33
10.16.3	Procedure	33
10.16.4	Final measurements.....	33
10.16.5	Requirements	33
10.17	Hail test.....	33
10.17.1	Purpose	33
10.17.2	Apparatus	33
10.17.3	Procedure	35
10.17.4	Final measurements.....	36
10.17.5	Requirements	36
10.18	Bypass diode thermal test.....	36
10.18.1	Purpose	36
10.18.2	Apparatus	37
10.18.3	Procedure 1	37
10.18.4	Procedure 2	38
10.18.5	Final Measurements.....	38
10.18.6	Requirements	39
10.19	Light-soaking	39
10.19.1	Purpose	39
10.19.2	Apparatus	39
10.19.3	Procedure	39
10.19.4	Final measurements.....	39
10.19.5	Requirements	39
	Bibliography.....	40
	Figure 1 – Qualification test sequence	12
	Figure 2 – NOCT correction factor	21
	Figure 3 – Hot-spot effect in a thin-film module with serially connected cells. Worst case shading condition is shading of 4 cells at the same time	24
	Figure 4 – Thermal cycling test.....	28
	Figure 5 – Humidity-freeze cycle.....	29
	Figure 6 – Hail test equipment	35
	Figure 7 – Impact locations.....	36
	Figure 8 – Bypass Diode Thermal Test	38
	Table 1 – Summary of test levels	13
	Table 2 – Ice ball masses and test velocities	34
	Table 3 – Impact locations	36

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

THIN-FILM TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES – DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61646 has been prepared by IEC technical committee 82: Solar photovoltaic energy systems.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1996. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

The major change is in the pass/fail criteria. It no longer relies on meeting a plus/minus criterion before and after each test, but rather on meeting the rated power after all of the tests have been completed and the modules have been light-soaked. This was done to eliminate the technology-specific preconditioning necessary to accurately measure the changes caused by the test. (Some modules lose power in light while others lose power during dark heat.) Since all modules must work after exposure to light, this seemed like a good approach and will streamline the test procedure, hopefully reducing the testing cost.

- Updated Normative references.
- Added a definition of "minimum value of maximum output power".

This is a preview of "IEC 61646 Ed. 2.0 b:...". [Click here to purchase the full version from the ANSI store.](#)

- Modified the wording in Major visual defects to allow some bending and misalignment without failure.
- Added requirements to the report from ISO/IEC 17025.
- Removed the "Twist Test" as was done from IEC 61215, since no one has ever failed this test.
- Made the pass/fail criteria for insulation resistance and wet leakage current dependent on the module area.
- Added the temperature coefficient of power (δ) to the required measurements.
- Modified temperature coefficient section to allow for measurements under natural sunlight or a solar simulator.
- Deleted reference plate method from NOCT.
- Added apparatus sections to those test procedures that did not have apparatus sections in edition 1.
- Rewrote the hot-spot test.
- Eliminated edge dip method from wet leakage current test.
- Changed mechanical load test to 3 cycles to be consistent with other standards.
- Added bypass diode thermal test.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
82/512/FDIS	82/528/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

THIN-FILM TERRESTRIAL PHOTOVOLTAIC (PV) MODULES – DESIGN QUALIFICATION AND TYPE APPROVAL

1 Scope and object

This International Standard lays down requirements for the design qualification and type approval of terrestrial, thin-film photovoltaic modules suitable for long-term operation in general open-air climates as defined in IEC 60721-2-1. This standard is intended to apply to all terrestrial flat plate module materials not covered by IEC 61215.

The test sequence is derived from IEC 61215 for the design qualification and type approval of terrestrial crystalline silicon PV modules. However, it no longer relies on meeting a plus/minus criterion before and after each test, but rather on meeting a specified percentage of the rated minimum power after all of the tests have been completed and the modules have been light-soaked. This eliminates the technology-specific preconditioning necessary to accurately measure the changes caused by the test.

This standard does not apply to modules used with concentrators.

The object of this test sequence is to determine the electrical and thermal characteristics of the module and to show, as far as possible within reasonable constraints of cost and time, that the module is capable of withstanding prolonged exposure in climates described in the scope. The actual life expectancy of modules so qualified will depend on their design, their environment and the conditions under which they are operated.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-1: *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 60068-2-21: *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

IEC 60068-2-78:2001, *Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state*

IEC 60410, *Sampling plans and procedures for inspection by attributes*

IEC 60721-2-1, *Classification of environmental conditions – Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature – Temperature and humidity*

IEC 60891, *Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics of crystalline silicon photovoltaic (PV) devices*

IEC 60904-1:2006, *Photovoltaic devices – Part 1: Measurements of photovoltaic current-voltage characteristics*

IEC 60904-2, *Photovoltaic devices – Part 2: Requirements for reference solar devices*

IEC 60904-3, *Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data*

IEC 60904-7, *Photovoltaic devices – Part 7: Computation of spectral mismatch error introduced in the testing of a photovoltaic device*

IEC 60904-9, *Photovoltaic devices – Part 9: Solar simulator performance requirements*

IEC 60904-10, *Photovoltaic devices – Part 10: Methods of linearity measurements*

IEC 61215, *Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval*

ISO/IEC 17025, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.*

3 Sampling

Eight modules for qualification testing (plus spares as desired) shall be taken at random from a production batch or batches, in accordance with the procedure given in IEC 60410. The modules shall have been manufactured from specified materials and components in accordance with the relevant drawings and process sheets and shall have been subjected to the manufacturer's normal inspection, quality control and production acceptance procedures. The modules shall be complete in every detail and shall be accompanied by the manufacturer's handling, mounting and connection instructions, including the maximum permissible system voltage.

If the bypass diodes are not accessible in the standard modules, a special sample can be prepared for the bypass diode thermal test (see 10.18). The bypass diode should be mounted physically as it would be in a standard module, with a thermal sensor placed on the diode as required in 10.18.2. This sample does not have to go through the other tests in the sequence.

When the modules to be tested are prototypes of a new design and not from production, this fact shall be noted in the test report (see Clause 8).

4 Marking

Each module shall carry the following clear and indelible markings:

- name, monogram or symbol of manufacturer;
- type or model number;
- serial number;
- polarity of terminals or leads (colour coding is permissible);
- maximum system voltage for which the module is suitable;
- nominal and minimum values of maximum output power at STC, as specified by the manufacturer for the product type.

The minimum value of maximum output power refers to the lowest stabilized power that the manufacturer specifies for the product type (for example after any light induced degradation or recovery).

NOTE If the modules to be tested are prototypes of a new design and not from production, the results of this test sequence may be used to establish the module minimum power rating.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	45
1 Domaine d'application et objet	47
2 Références normatives	47
3 Echantillonnage	48
4 Marquage	48
5 Essais	49
6 Conditions d'acceptation	49
7 Défauts visuels majeurs	50
8 Rapport d'essai	50
9 Modifications	51
10 Procédures d'essai	54
10.1 Examen visuel	54
10.1.1 Objet	54
10.1.2 Procédure	54
10.1.3 Exigences	54
10.2 Détermination de la puissance maximale	54
10.2.1 Objet	54
10.2.2 Equipement	54
10.2.3 Procédure	55
10.3 Essai d'isolement	55
10.3.1 Objet	55
10.3.2 Equipement	55
10.3.3 Conditions d'essai	55
10.3.4 Procédure	55
10.3.5 Exigences d'essai	56
10.4 Mesure des coefficients de température	56
10.4.1 Objet	56
10.4.2 Equipement	56
10.4.3 Procédure	56
10.5 Mesure de la température nominale d'utilisation des cellules (NOCT)	58
10.5.1 Objet	58
10.5.2 Introduction	58
10.5.3 Principe	59
10.5.4 Equipement	59
10.5.5 Installation du module en essai	59
10.5.6 Procédure	60
10.6 Performance à STC et NOCT	61
10.6.1 Objet	61
10.6.2 Equipement	62
10.6.3 Procédure	62
10.7 Performance sous faible éclairage	62
10.7.1 Objet	62
10.7.2 Equipement	62
10.7.3 Procédure	62
10.8 Essai d'exposition en site naturel	63
10.8.1 Objet	63

10.8.2	Equipement	63
10.8.3	Procédure	63
10.8.4	Mesures finales	63
10.8.5	Exigences	63
10.9	Essai de tenue à l'échauffement localisé	63
10.9.1	Objet	63
10.9.2	Effet de l'échauffement localisé	63
10.9.3	Classification des interconnexions de cellules	64
10.9.4	Equipement	65
10.9.5	Procédure	65
10.9.6	Mesures finales	66
10.9.7	Exigences	67
10.10	Essai de préconditionnement pour les UV	67
10.10.1	Objet	67
10.10.2	Appareillage	67
10.10.3	Procédure	67
10.10.4	Mesures finales	67
10.10.5	Exigences	67
10.11	Essai de cycle thermique	68
10.11.1	Objet	68
10.11.2	Appareillage	68
10.11.3	Procédure	68
10.11.4	Mesures finales	69
10.11.5	Exigences	69
10.12	Essai humidité-gel	69
10.12.1	Objet	69
10.12.2	Appareillage	69
10.12.3	Procédure	70
10.12.4	Mesures finales	70
10.12.5	Exigences	70
10.13	Essai continu de chaleur humide	71
10.13.1	Objet	71
10.13.2	Procédure	71
10.13.3	Mesures finales	71
10.13.4	Exigences	71
10.14	Essai de robustesse des sorties	71
10.14.1	Objet	71
10.14.2	Types de sorties	71
10.14.3	Procédure	71
10.14.4	Mesures finales	72
10.14.5	Exigences	72
10.15	Essai de courant de fuite	72
10.15.1	Objet	72
10.15.2	Appareillage	72
10.15.3	Procédure	73
10.15.4	Exigences	73
10.16	Essai de charge mécanique	73
10.16.1	Objet	73
10.16.2	Appareillage	73

10.16.3	Procédure	74
10.16.4	Mesures finales	74
10.16.5	Exigences	74
10.17	Essai à la grêle	74
10.17.1	Objet.....	74
10.17.2	Appareillage	74
10.17.3	Procédure	75
10.17.4	Mesures finales	76
10.17.5	Exigences	77
10.18	Essai thermique de la diode bypass	77
10.18.1	Objet.....	77
10.18.2	Appareillage	77
10.18.3	Procédure 1	77
10.18.4	Procédure 2	78
10.18.5	Mesures finales	79
10.18.6	Exigences	79
10.19	Exposition prolongée au rayonnement lumineux	79
10.19.1	Objet.....	79
10.19.2	Appareillage	79
10.19.3	Procédure	79
10.19.4	Mesures finales	80
10.19.5	Exigences	80
Bibliographie		81
Figure 1 – Séquence d'essais de qualification.....		52
Figure 2 – Facteur de correction de NOCT		61
Figure 3 – Effet d'un échauffement localisé sur un module en couches minces avec cellules connectées en série. Le cas le plus défavorable de condition de masquage est le masquage de 4 cellules en même temps		64
Figure 4 – Essai de cycle thermique		68
Figure 5 – Cycle humidité-gel		70
Figure 6 – Equipement pour l'essai de tenue à la grêle		75
Figure 7 – Localisation des points d'impact.....		76
Figure 8 – Essai thermique de la diode bypass		78
Tableau 1 – Résumé des niveaux d'essai		53
Tableau 2 – Masses des billes de glace et vitesses d'essai		75
Tableau 3 – Localisation des impacts		76

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES (PV) EN COUCHES MINCES POUR APPLICATION TERRESTRE – QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET HOMOLOGATION

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61646 a été établie par le comité d'études 82 de la CEI: Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire.

La présente seconde édition annule et remplace la première édition publiée en 1996. La présente édition constitue une révision technique.

La présente édition inclut les modifications techniques significatives suivantes par rapport à l'édition précédente:

La modification majeure concerne les critères d'acceptation/de refus. Il ne s'agit plus de la satisfaction à un critère plus/moins avant et après chaque essai, mais plutôt de la satisfaction de la puissance assignée après la fin de tous les essais et l'exposition prolongée au rayonnement lumineux des modules. Ceci a été réalisé en éliminant le nécessaire préconditionnement spécifique de la technologie pour mesurer avec précision les modifications engendrées par l'essai. (Certains modules perdent de la puissance à la lumière, tandis que d'autres la perdent durant la chaleur obscure.) Comme tous les modules doivent fonctionner

après l'exposition à la lumière, ceci semble être une bonne approche et rationalisera la procédure d'essai, en espérant réduire le coût des essais.

- Mise à jour des Références normatives.
- Ajout d'une définition de « valeur minimum de la puissance maximale de sortie ».
- Modification de la formulation dans les défauts visuels majeurs pour permettre quelques flexions et désalignements sans défaillance.
- Ajout d'exigences au rapport de l'ISO/CEI 17025.
- Retrait de « l'essai de vrillage » comme ce qui a été fait pour la CEI 61215, étant donné que personne n'a réussi à faire échouer cet essai.
- Etablissement de critères d'acceptation/de refus pour la résistance d'isolement et le courant de fuite en milieu humide dépendant de la surface du module.
- Ajout du coefficient de température de puissance (δ) aux mesures exigées.
- Modification du paragraphe sur le coefficient de température pour permettre les mesures en éclairage naturel ou délivré par un simulateur solaire.
- Suppression de la méthode de la plaque de référence de la NOCT.
- Ajout de paragraphes sur les équipements dans les procédures d'essai qui n'en avaient pas à l'édition 1.
- Réécriture de l'essai de tenue à l'échauffement localisé.
- Suppression de la méthode d'immersion du bord de l'essai de courant de fuite en milieu humide.
- Modification de l'essai de charge mécanique à 3 cycles pour être cohérent avec les autres normes.
- Ajout de l'essai thermique de la diode bypass.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
82/512/FDIS	82/528/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La présente publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la présente publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

MODULES PHOTOVOLTAÏQUES (PV) EN COUCHES MINCES POUR APPLICATION TERRESTRE – QUALIFICATION DE LA CONCEPTION ET HOMOLOGATION

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale donne les exigences sur la qualification de la conception et l'homologation des modules photovoltaïques en couches minces pour application terrestre et pour une utilisation de longue durée dans les climats généraux d'air libre, définis dans la CEI 60721-2-1. La présente norme est destinée à s'appliquer à tous les équipements à module à plaque plane non couverts par la CEI 61215.

La séquence d'essais est issue de celle spécifiée dans la CEI 61215 pour la qualification de la conception et l'homologation des modules PV au silicium cristallin pour application terrestre. Toutefois, elle ne dépend plus de la satisfaction à un critère plus/moins avant et après chaque essai, mais plutôt de la satisfaction à un pourcentage spécifique de la puissance assignée minimum après la fin de tous les essais et l'exposition prolongée au rayonnement lumineux des modules. Ceci élimine le nécessaire préconditionnement spécifique de la technologie pour mesurer avec précision les modifications engendrées par l'essai.

La présente norme ne s'applique pas aux modules utilisés avec des concentrateurs.

L'objet de la présente séquence d'essais est de déterminer les caractéristiques électriques et thermiques du module et de montrer, autant que possible avec des contraintes de coût et de temps raisonnables, que le module est apte à supporter une exposition prolongée aux climats définis dans le domaine d'application. L'espérance de vie réelle des modules ainsi qualifiés dépendra de leur conception ainsi que de l'environnement et des conditions dans lesquelles ils fonctionneront.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60068-1, *Essais d'environnement. Première partie: Généralités et guide*

IEC 60068-2-21, *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices* (disponible en anglais seulement)

CEI 60068-2-78:2001, *Essais d'environnement – Partie 2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide, essai continu*

CEI 60410, *Plans et règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs*

CEI 60721-2-1, *Classification des conditions d'environnement – Partie 2-1: Conditions d'environnement présentes dans la nature – Température et humidité*

CEI 60891, *Procédures pour les corrections en fonction de la température et de l'éclairage à appliquer aux caractéristiques I-V mesurées des dispositifs photovoltaïques au silicium cristallin*

CEI 60904-1:2006, *Dispositifs photovoltaïques – Partie 1: Mesure des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques*

CEI 60904-2, *Dispositifs photovoltaïques – Partie 2: Exigences relatives aux dispositifs solaires de référence*

CEI 60904-3, *Dispositifs photovoltaïques – Partie 3: Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l'éclairement spectral de référence*

CEI 60904-7, *Dispositifs photovoltaïques – Partie 7: Calcul de l'erreur de désadaptation des réponses spectrales introduite dans les mesures de test d'un dispositif photovoltaïque*

CEI 60904-9, *Dispositifs photovoltaïques – Partie 9: Exigences pour le fonctionnement des simulateurs solaires*

CEI 60904-10, *Dispositifs photovoltaïques – Partie 10: Méthodes de mesures de la linéarité*

CEI 61215, *Modules photovoltaïques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre – Qualification de la conception et homologation*

ISO/CEI 17025, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais*

3 Echantillonnage

Huit modules pour les essais de qualification (plus le nombre de modules de rechange désiré) doivent être prélevés au hasard parmi un ou plusieurs lots de production, conformément à la procédure indiquée dans la CEI 60410. Les modules doivent avoir été fabriqués à partir de matériaux et de composants spécifiés, conformément aux schémas et aux procédures de fabrication correspondants et doivent avoir été soumis au contrôle normal du fabricant et aux procédures du contrôle de la qualité et de l'acceptation de la production. Les modules doivent être dans leur intégrité, jusqu'au moindre détail, et doivent être accompagnés d'instructions de manipulation, de montage et de raccordement fournies par le fabricant, incluant la tension maximale permise du système.

Si les diodes bypass ne sont pas accessibles dans des modules standards, un échantillon spécial peut être préparé pour l'essai thermique de la diode bypass (10.18). Il est recommandé de monter physiquement la diode bypass comme elle pourrait être dans un module standard, avec un capteur thermique placé sur la diode tel qu'exigé au Paragraphe 10.18.2. Cet échantillon ne doit pas occulter les autres essais de la séquence.

Si les modules à essayer sont des prototypes d'une nouvelle conception mais non issus d'une production, la mention doit en être faite dans le rapport d'essai (voir Article 8).

4 Marquage

Chaque module doit porter clairement et de manière indélébile les indications suivantes:

- nom, monogramme ou symbole du fabricant;
- type ou numéro du modèle;
- numéro de série;
- polarité des bornes de sorties ou des conducteurs (un code de couleur est autorisé);
- tension maximale du système pour laquelle le module est adapté;